



معرفی اجمالی دستگاه: Atomic Force Microscopy (AFM)



با استفاده از این دستگاه تصویر برداری از سطوح مختلف در مقیاس نانو امکان پذیر می باشد. در این روش نیازی به آن نیست که نمونه رسانای جریان الکتریکی باشد و ایجاد پوشش هادی جریان الکتریکی نیز لزومی ندارد میکروسکوپ نیروی اتمی دارای وسعت عمل در تصویر برداری از سطوح یکپارچه و همچنین چند تکه است.

کاربردهای تحقیقاتی دستگاه: Atomic Force Microscopy (AFM)

تصویر برداری از ماکر مولکولهای زیستی (مانند گلیکو پروتئینها و DNA تصویر برداری از سلول ها تصویر برداری از رسپتورهای سطح سلولی و کانالهای سلولی بصورت زنده اندازه گیری ویسکوزیته سطح، اندازه گیری اندازه و شکل نانو پارتیکلها و توپولوژی سطوح نانو.

شناسنامه سند: NanoLab. 2	
نام سند	معرفی اجمالی دستگاه AFM
تاریخ صدور	سال ۱۴۰۴
نام کامل فایل	دستگاه AFM
شرح سند	دستگاه AFM ساخت کشور آلمان واقع در مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی همکار آزمایشگاه جامع تحقیقات
تهیه کننده	نام تهیه کننده: رضا جوانشیر